# Нелокальные эффекты при диффузионном распространении тепловых импульсов в системах с центрами захвата неравновесных фононов

## © Е.И. Саламатов

Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук, 426000 Ижевск, Россия

E-mail: salam@oft.fti.udmurtia.su

(Поступила в Редакцию 26 июня 2001 г. В окончательной редакции 30 августа 2001 г.)

Теоретически изучен процесс распространения тепловых импульсов в системах с дефектами, являющимися центрами захвата неравновесных фононов. К таким дефектам относятся точечные дефекты, на которых реализуются двухуровневые системы (ДУС) различной природы. Показано, что при определенном соотношении между временами релаксации в подсистемах фононов и ДУС наряду с основным сигналом на болометре может появиться дополнительный сигнал, обусловленный переизлучением энергии неравновесных ДУС. Исследуются температурная и концентрационная зависимости времени прихода сигналов на болометр. Результаты теоретических исследований сравниваются с экспериментальными данными по распространению слабонеравновесных тепловых фононов в твердых растворах редкоземельных иттрий-алюминиевых гранатах  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ .

Работа поддержана Российским фондом фундаметальных исследований № (грант № 00-02-17426).

Распространение слабонеравновесных фононов (СНФ), инжектируемых "теплым" генератором  $S/T \ll 1$ (S — превышение температуры генератора над температурой термостата T), является одним из основных методов изучения структуры систем, в которых реализуется сильное рассеяние фононов на дефектах (смешанных кристаллов, аморфных материалов и керамик [1-4]). Несмотря на то что в настоящее время существует много теоретических работ по распространению СНФ в реальных материалах (см., например, [5-8]), проблема не может считаться решенной, в частности не до конца понятны механизмы аномального замедления слабонеравновесных фононов (до двух порядков) в твердых растворах редкоземельных иттрийалюминиевых гранатов  $Y_{3-x}R_xAl_5O_{12}$  (R = Er, Ho, Tb).

Трудности при теоретическом изучении этого явления обусловлены тем, что распространение короткого теплового импульса является существенно нестационарным процессом, что при наличии в системе низкоэнергетических двухуровневых систем (ДУС) может приводить к ее пространственной неоднородности, связанной с зависимостью состояния ДУС от координаты. Известно, что нестационарный режим обмена энергии с термостатом в системе, состоящей из подсистем с различными временами релаксации, может существенно отличаться от стационарного случая. Так, в работе [9] показано, что процесс охлаждения электронно-дырочной плазмы в полупроводниках в динамическом режиме (после импульсного разогрева плазмы) описывается двумя характерными временами релаксации, значительно отличающимися друг от друга ( $\tau_1 \ll \tau_2$ ). Первое характеризует остывание плазмы и нагрев оптических фононов до выравнивания их эффективных температур, а второе медленное остывание всей системы. Далее будет показано, что аналогичные процессы могут наблюдаться и при распространении короткого теплового импульса в диэлектриках, содержащих достаточную концентрацию ДУС, что и определяет аномальную зависимость времени распространения фононов в таких системах.

## 1. Основные уравнения

i

При описании процессов распространения теплового импульса будем исходить из следующих кинетических уравнений, формально совпадающих с уравнениями, использованными в работе [9]:

$$\frac{\partial n_q}{\partial t} + (\Gamma_{tq} + \Gamma_L)n_q = \Gamma_L n_{q0} + \Gamma_{tq} n_{q0}, \qquad (1)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 \int \omega_q \Gamma_{tq} (n_q - n_{t0}) d^3 q.$$
(2)

Здесь  $n_{q0}$ ,  $n_{t0}$  — равновесные числа заполнения фононов при температуре термостата и эффективной температуре ДУС соответственно, E — энергия ДУС,  $\Gamma_{tq}$  скорость рассеяния фононов на ДУС,  $\Gamma_L$  — скорость обмена энергии фононов с термостатом. В линейном приближении по отклонению температуры подсистем  $S_q$ ,  $S_t$  от температуры термостата T ( $S_i = T_i - T$ ) систему уравнений (1), (2) можно преобразовать к следующему виду:

$$\frac{\partial S_q}{\partial t} + (N\Gamma + \Gamma_L)S_q = N\Gamma S_{ti},\tag{3}$$

$$\frac{\partial S_t}{\partial t} = \Gamma \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} \left( S_q - S_t \right),\tag{4}$$

где  $c_{\rm ph}{=}4\pi^4(T/T_{\rm D})^3/5$  и  $c_{\rm tls}=(\Delta/T)^2\exp(-\Delta/T)/(1+\exp(-\Delta/T))^2$  — теплоемкости фононов и ДУС соот-

ветственно, N — концентрация,  $\Delta$  — параметр ДУС,  $T_{\rm D}$  — температура Дебая. При получении выражений (3), (4) авторы пренебрегли зависимостью  $\Gamma_{tq}$  от q и ограничились линейным по концентрации дефектов N приближении, полагая, что  $\Gamma_{tq} = N\Gamma$ , где  $\Gamma$  — скорость рассеяния фононов в расчете на один дефект.

# Пространственно-однородный случай

Прежде чем перейти к рассмотрению пространственно-неоднородной задачи, рассмотрим более простой случай. Пусть в пространственно-однородной системе в начальный момент времени вся избыточная энергия содержится в подсистеме ДУС  $S_t(0) = S(0), S_q(0) = 0$ . Такая ситуация может быть реализована экспериментально при накачке энергии в подсистему парамагнитных уровней путем короткого импульса СВЧ [10]. С помощью преобразования Лапласа по временной переменной для эффективной температуры подсистемы ДУС нетрудно получить

$$S_q(t) = S(0) \left( A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \right), \tag{5}$$

где обратные времена релаксации  $-p_1$ ,  $-p_2$  являются решениями квадратного уравнения

$$p^{2} + p[N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}) + \Gamma_{L}] + c_{\rm ph}\Gamma\Gamma_{L}/c_{\rm tls} = 0, \quad (6)$$

а коэффициенты А1, А2 имеют вид

$$A_1 = 1 - A_2 = \frac{(p_1 + \Gamma_L + \Gamma c_{\rm ph}/c_{\rm tls})}{(p_1 - p_2)}.$$

Удобно проанализировать решение (6) в том случае, когда одно из слагаемых в квадратных скобках много больше (меньше) другого. В этом случае

$$-p_1 = 1/\tau_1 = \Gamma N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}) + \Gamma_L,$$
  
$$-p_2 = 1/\tau_2 = \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} \frac{\Gamma \Gamma_L}{(\Gamma N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}) + \Gamma_L)}.$$

При быстром теплообмене между фононами и термостатом,  $\Gamma_L \gg \Gamma N (1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls})$ , узкого фононного горла не возникает, и в используемом приближении скорость релаксации ДУС не зависит от их концентрации

$$1/\tau_1 = \Gamma_L$$
,  $1/\tau_2 = \Gamma c_{\rm ph}/c_{\rm tls}$ .

При наличии узкого фононного горла,  $\Gamma_L \ll \Gamma N (1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls})$ , времена релаксации становятся зависимыми от концентрации дефектов

$$1/\tau_1 = \Gamma N (1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}) = \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} \frac{\Gamma}{C}, \qquad (7)$$

$$1/\tau_2 = \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} \frac{\Gamma_L}{N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls})} = \Gamma_L C, \qquad (8)$$

где  $C = c_{\rm ph} / (N c_{\rm tls} + c_{\rm ph}) < 1.$ 

Время  $\tau_1$  определяет быстрый процесс выравнивания температур подсистемы ДУС и фононов, который определяется сечением рассеяния фононов на ДУС. После выравнивания температур начинается медленная релаксация всей системы с характерным временем  $\tau_2$ . Этот процесс контролируется взаимодействием фононов с термостатом и в использованном при записи выражения (8) пределе не зависит от Г, а определяется только скоростью обмена энергии фононов с термостатом. Как правило, в экспериментах выполняется условие  $c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls} \ll 1$ , и выражение (8) совпадает с известным выражением Альтшулера [11].

Если характерное время обмена энергии фононов с термостатом определяется только временем диффузионного распространения фононов по объему образца с характерным линейным размером L, то для времени релаксации  $\tau_2$  нетрудно получить

$$1/\tau_2 = AL^2/(DC), \tag{8a}$$

где D — коэффициент диффузии фононов, A — численный коэффициент порядка единицы, зависящий от геометрии образца. В этом случае условие реализации режима узкого фононного горла можно записать в виде  $L^2 > L_0^2 = D\tau_1/A$ .

Далее будет показано, что параметры, описывающие процесс релаксации энергии подсистемы ДУС и фононов в режиме узкого фононного горла в пространственнооднородном случае, являются важными параметрами и при описании распространения тепловых импульсов в таких системах.

# 3. Распространение теплового импульса

Рассмотрим задачу распространения  $\delta$ -образного теплового импульса из начала координат в бесконечный одномерный образец. В этом случае в качестве  $\Gamma_L$  в уравнении (1) надо взять диффузионный член, т.е. положить  $\Gamma_L = -D_0\partial^2/\partial z^2$ , где  $D_0$  — коэффициент диффузии фононов, определяемый только упругим рассеянием фононов на дефектах. (Здесь мы пренебрегаем теплообменом образца с термостатом). Пространственный Фурье-образ функции  $S_q(t, k)$  будет формально совпадать с выражением (5)

$$S_q(t,k) = S(0) \left( A_1(k) e^{-k^2 D_1(k)t} + A_2(k) e^{-k^2 D_2(k)t} \right).$$

Здесь S(0) — мощность теплового испульса,  $D_i(k) = -p_i(k)/k^2$  — эффективные коэффициенты диффузии фононов,  $p_i(k)$  определяются из квадратного уравнения, аналогичного (6),

$$A_1 = 1 - A_2 = (p_1 + D_0 k^2 + \Gamma c_{\rm ph} / c_{\rm tls}) / (p_1 - p_2).$$
(9)

В безразмерных переменных k' = kL,  $D'_i(k) = D_i(k)/D_0$ ,  $t' = t/t_0$ , где L — координата точки измерения температуры (длина образца),  $t_0 = L^2/2D_0$  — характерное время распространения фононов, вычислен-

ное при учете только упругого рассеяния фононов на дефектах. Для эффективных коэффициентов диффузии имеем

$$D_{1,2}'k^{2} = \left(k_{0}^{2} + {k'}^{2} + \sqrt{\left(k_{0}^{2} + {k'}^{2}\right)^{2} - 4{k'}^{2}k_{0}^{2}C}\right) / 2.$$
(10)

Входящие в это выражение параметры  $C = c_{\rm ph}/(c_{\rm ph}+Nc_{\rm tls}) < 1$  и  $k_0^2 = (L/L_0)^2$  для одномерного случая (A = 1) были введены в конце предыдущего раздела. Из выражений (9), (10) следует, что при  $k' \gg k_0 D'_1 = 1$ ,  $A_1 = 1$ , а при  $k' \ll k_0 D'_2 = C$ ,  $A_2 = C$ .

Пространственная дисперсия коэффициентов диффузии  $D_i(k')$  представлена на рис. 1, из которого становится понятен физический смысл введенных параметров. Если  $k_0 \gg 1$ , в системе реализуется режим узкого фононного горла, и время прихода сигнала на болометр определяется медленными процессами:  $t_2 = L^2/(2D_0C)$  согласно выражению (8a). В случае  $k_0 \ll 1$  (в отсутствии фононного горла) фононная система не успевает среагировать на изменения в подсистеме ДУС, и время распространения сигнала не зависит от состояния ДУС,  $t_1 = t_0 = L^2/(2D_0)$ .

При промежуточных значениях  $k_0$  удобно записать выражение для него в другом эквивалентном виде:  $k_0 = \sqrt{2t_0/\tau_1}$ . Из этого выражения следует, что  $k_0$ возрастает с ростом числа фононов, успевших неупруго провзаимодействовать с ДУС, для которых реализуется режим узкого фононного горла. Остальные фононы не испытывают неупруго рассеяния на ДУС и их распространение определяется в основном коэффициентом  $D_0$ . Результаты численных расчетов  $S_q(t')$  в точке L для различных значений  $k_0$  и C представлены на рис. 2. Из представленных на рисунке зависимостей следует, что амплитуда и положение первого максимума в основном



Рис. 1. Пространственная дисперсия эффективных коэффициентов диффузии.



**Рис. 2.** a — форма сигнала фононной неравновесности в зависимости от параметра  $k_0$  при C = 0.1:  $k_0 = 0.0$  (1), 3.0 (2), 10.0 (3); b — форма сигнала в зависимости от параметра C при  $k_0 = 3$ . C = 0.1 (1), 0.05 (2), 0.01 (3).

определяется параметром  $k_0$ , в то время как форма и положение второго — параметром C.

При приближенном описании зависимости положения и формы максимумов от параметров задачи ограничимся пределом  $C \ll 1$ . В этом случае

$$A_1(k) = 1 - A_2(k) \simeq 1 - C, \quad k < k_0,$$
  
 $A_1(k) = 1 - A_2(k) \simeq 1, \quad k > k_0$ 

и можно получить приближенные выражения, описывающие положение и форму пиков. Для первого пика получаем

$$S_1(t) \simeq e^{-k_0^2 t/t_0} e^{-L^2/4D_0 t} \sqrt{rac{\pi}{4D_0 t}}$$

из которого для времени прихода его максимума на болометр имеем

$$t_1 = \frac{\sqrt{4k_0^2 + 1 - 1}}{2k_0^2} t_0. \tag{11}$$



**Рис. 3.** Нормированное на длину образца время прихода первого максимума для различных L = 4, 6, 8, 10 mm (снизу вверх).

Приближенное выражение для описания положения и формы второго можно записать только для достаточно больших значений  $k_0$ 

$$S_2(t) \simeq C \sqrt{\frac{\pi}{4D_0Ct}} e^{-L^2/4D_0Ct}, \qquad t_2 = t_0/C.$$
 (12)

(Заметим, что в рассматриваемом пределе реализуется режим узкого фононного горла и время распространения сигнала не зависит от  $\tau_1$ ).

Перейдем к рассмотрению температурной и концентрационной зависимости процесса распространения теплового импульса. К сожалению, авторам не известны эксперименты по исследованию спин-решеточной релаксации в этих системах в режиме узкого фононного горла и далее будем считать k<sub>0</sub> подгоночным параметром модели, полагая для определенности, что температурная зависимость скорости релаксации  $\Gamma(T)$  в (7) является экспоненциальной [11],  $\Gamma(T) = \Gamma_0 \exp(-\Delta/T)$  (далее будет показано, что при такой температурной зависимости теоретические результаты вполне удовлетворительно описывают экспериментальные данные). Если считать, что  $D_0$  определяется релеевским рассеянием на дефектах ( $D_0 \sim 1/NT^4$ ), получаем, что  $k_0$  растет как с ростом температуры, так и концентрации дефектов,  $k_0 \sim NLT^2\Gamma^{1/2}$ . При выполнении условия  $k_0 \geq 1$  из выражения (11) следует, что  $t_1$  не зависит от концентрации и растет линейно по параметру L, т.е. ведет себя как сигнал от баллистических фононов, но убывает с ростом температуры. Поскольку при малых  $k_0 t_1 \sim T^4$ , зависимость  $t_1(T)$  имеет максимумом, положение которого определяется температурной зависимостью  $\Gamma(T)$ . На рис. 3 представлены зависимости  $t_1(T)/L$ , рассчитанные по формуле (11) при различных значениях параметра Lи фиксированных значениях N и  $\Gamma_0$ , поведение которых качественно совпадает с известными нам экспериментальными данными [4]. Специальные экспериментальные исследования температурной и концентрационной зависимости  $t_1$  при различных L не проводились, но в работе [10] отмечалось, что первый пик ведет себя подобно баллистическому сигналу.

При анализе температурной и концентрационной зависимости времени прихода второго пика ограничимся случаем, когда  $k_0 \gg 1$ , который всегда можно реализовать, рассматривая достаточно длинный образец. При этом вкладом в сигнал на болометре от первого пика можно пренебречь. Для времени прихода максимума второго сигнала имеем

$$t_2(T,N) \sim \frac{L^2}{2D_0(T,N)C(T,N)}.$$

На рис. 4 показана температурная зависимость  $t_2/N$  при  $D_0 \sim 1/NT^4$  и различных концентрациях дефектов. Из рисунка следует, что при достаточно большой концентрации дефектов, когда в области температур вблизи  $\Delta Nc_{\rm tls} \gg c_{\rm ph}$ , зависимость  $t_2(T)$  не является монотонной. При  $T < 0.5\Delta$  она экспоненциально растет, а при  $T > 0.5\Delta$ , когда  $c_{\rm tls} \sim 1/T^2$ , становится убывающей,  $t_2 \sim 1/T$ . В остальных областях температуры, для которых  $Nc_{\rm tls} \ll c_{\rm ph}$ , и для малых концентраций дефектов зависимость  $t_2(T)$  имеет обычный характер,



**Рис. 4.** Время прихода второго максимума, нормированного на концентрацию, при  $\Delta/T = 0.01$  и различных значениях *x*: x = 0 (1), 0.05 (2), 0.5 (3).

 $t_2(T) \sim T^4$ . Что касается концентрационной зависимости  $t_2$ , то в области температур, где  $c_{\rm tls} \gg c_{\rm ph}$ ,  $t_2(N) \sim N^2$ .

Проведенный анализ показывает, что предложенная модель качественно описывает температурную и концентрационную зависимость формы сигнала фононной неравновесности, экспериментально наблюдаемую в иттрий-алюминиевых гранатах  $Y_{3-x}R_xAl_5O_{12}$  (R = Er, Ho, Tb).

#### 4. Сравнение с экспериментом

Кинетика фононов твердых растворах в  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$  экспериментально исследована достаточно полно. Обнаружено, что при x > 0.2 наблюдается появление второго максимума в сигнале фононной неравновесности и значительное замедление процесса распространения фононов, причем температурная зависимость времени прихода максимума второго сигнала на болометр сложным образом зависит от концентрации примесных атомов эрбия и длины образца. При небольшом содержании примесных атомов  $(0.2 < x < 0.6) t_2(T)$  очень быстро (может быть, экспоненциально [10]) возрастает с ростом температуры, а при больших значениях х температурная зависимость  $t_2(T)$  характеризуется отрицательной производной. При промежуточных значениях концентрации х знак производной  $t_2(T)$  определяется главным образом размерами образца.

Из результатов предыдущих разделов нетрудно понять, что такое поведение  $t_2(T)$  в зависимости от концентрации в рамках предлагаемой модели может быть объяснено только при наличии в системе двух подсистем ДУС с отличными друг от друга энергетическими параметрами  $\Delta_1 < T < \Delta_2$ . Хотя решение задачи с двумя подсистемами ДУС принципиально не отличается от рассмотренного в предыдущих разделах, но приводит к некоторым качественно новым результатам (в частности, появлению третьего максимума на кривой сигнала фононной неравновесности, наблюдаемого в эксперименте [4]) и требует отдельного рассмотрения. Поэтому в данной работе ограничимся пределом больших значений параметра  $k_0$  (точнее, его аналога). В этом случае нетрудно получить физически понятный результат, что время прихода второго максимума определяется параметром  $C = c_{\rm ph}/(c_{\rm ph} + N_1 c_{\rm tls,1} + N_2 c_{\rm tls,2}),$ где N<sub>i</sub> и c<sub>tls,i</sub> — концентрация и теплоемкость ДУС *i*-й подсистемы соответственно.

Из экспериментов по измерению низкотемпературной теплоемкости известно, что в системе  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$  существует дважды вырожденный парамагнитный уровень с  $\Delta_2 = 38.9$  К [12]. Из рис. 4 следует, что именно эти ДУС могут приводить к очень быстрому росту  $t_2$  с температурой. На существование в этой системе низкоэнергетических парамагнитных уровней с  $\Delta_1 \simeq 4$  К указывают эксперименты по спин-решеточной релаксации [10]. При температурах эксперимента  $c_{tls,1} \gg c_{tls,2}$ ,

и для того чтобы вклад от второй подсистемы ДУС преобладал, концентрация высокоэнергетических ДУС при  $x \leq 0.6$  должна быть много больше концентрации низкоэнергетических ( $N_2 \gg N_1$ ). Это возможно в том случае, если низкоэнергетический уровень связан не с каждым примесным атомом, а с некоторой атомной конфигурацией. При малых концентрациях примеси вероятность образования таких конфигураций мала, т.е.  $N_1 \ll N_2$ . Видимо, именно такая ситуация наблюдается при малых концентрациях примесей в системе  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ , поэтому далее (кроме оговоренного случая) будем пренебрегать вкладом от низкоэнергетических ДУС, ограничиваясь рассмотрением малых концентраций ( $x \leq 0.6$ ).

Для решения задачи требуется определить коэффициент диффузии  $D_0$  и параметры C и  $k_0$ . Коэффициент диффузии  $D_0$  для системы с ДУС нельзя определить непосредственно из эксперимента, поэтому считалось, что в отсутствие ДУС он приблизительно равен последнему для системы  $Y_{3-x}Lu_xAl_5O_{12}$  $D_0 = (3.4/T)^4(0.2 + x_0)/(x + x_0) \text{ mm}^2/\mu$ s, где  $x_0 = 0.025$  — остаточная концентрация примесей [4]. Температура Дебая твердого раствора для расчета параметра C определялась по формуле  $T_D = T_{DY}(M_Y/M_s)^{1/2}$ , где  $T_{DY} = 750 \text{ K}$ ,  $M_Y$  — температура Дебая и молярная масса иттриевого граната,  $M_s$  — молярная масса твердого раствора [12,13]. Для определения  $k_0$ было использовано приближенное выражение (11). Из сравнения рассчитанной по формуле (11) температур-



**Рис. 5.** Температурная зависимость времени прихода ( $\mu$ s) первого (1) и второго максимума (x = 0.2 (2), 0.6 (3); 1.0 (4, 5)) в системе  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ . Штриховая кривая — время прихода максимума в системе без ДУС при x = 0.2.



Рис. 6. Сигнал фононной неравновесности в системах  $Y_{2.8}Er_{0.2}Al_5O_{12}$  (сплошные линии) и  $Y_{2.8}Lu_{0.2}Al_5O_{12}$  (штриховые линии) (L = 6.8 mm, T = 3.35 (1), 2.7 K (2)).

ной зависимости времени прихода первого максимума с экспериментальной (рис. 1 из [4]) было найдено, что  $\Gamma_0 = 6.78 \cdot 10^{-5} \,\mu s^{-1}$  на формульную единицу дефектов. Рассчитанные с этими значениями параметров зависимости  $t_{1,2}(T)$  для образцов длиной 6.8 mm и концентрацией примеси 0.2 и 0.6 формульных единиц представлены на рис. 5 (кривые 1-3). На рис. 6 представлены сигналы фононной неравновесности, соответствующие образцам  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$  (сплошные линии) и  $Y_{3-x}Lu_xAl_5O_{12}$  (штриховые линии) при двух температурах T = 3.85 и 2.7 К. Результаты теоретических расчетов, представленные на рис. 5 (кривые 1-3) и 6, вполне удовлетворительно согласуются с экспериментальными зависимостями (рис. 1, 3 из [4]).

Кривые 4 и 5 на рис. 5 имеют качественный характер и демонстрируют смену наклона зависимости  $t_2(T)$  при появлении в системе достаточного количества низкоэнергетических ДУС с  $\Delta_1 < T$ . Расчеты проводились для x = 1.0 и  $N_1 = 0.1 N_2$  при различной температурной зависимости коэффициента диффузии  $D_0(T)$ . При расчете кривой 4 полагалось, что коэффициент диффузии  $D_0$ , как и прежде, определяется релеевским рассеянием фононов на дефектах. Из выражения (12) следует, что в этом случае показатель степени  $\alpha$  в зависимости  $t_2(T) \sim T^{\alpha}$  не может принимать значения меньше -1, а в экспериментах наблюдается более сильная зависимость  $t_2(T)$  с отрицательной производной [4].

Можно предположить, что при достаточно больших концентрациях примесных атомов в системе  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$  затравочный коэффициент диффузии фононов  $D_0$  определяется главным образом рассеянием фононов на межфазных границах. В самом деле, твердые растворы  $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$  склонны к фазовому

расслоению, что приводит к образованию областей с характерными размерами 20–100 nm, обедненных и обогащенных примесными атомами [14]. Известно, что при распространении фононов в системах с сильно развитыми границами разделов температурная зависимость коэффициента диффузии фононов уже не определяется релеевским рассеянием, а сложным образом зависит от структуры границ (см., например, [15]). Для иллюстрации такой ситуации при расчете кривой 5 на рис. 5 было положено  $D_0(T) = \text{const}$ , что позволило получить зависимость  $t_2(T)$ , качественно совпадающую с экспериментальной (рис. 1 [4]).

Следует отметить, что причиной сильной температурной зависимости  $t_2(T)$  с отрицательной производной, наблюдаемой в экспериментах, может являться спектральный состав распространяющихся фононов, не учтенный при нашем упрощенном рассмотрении. В частности, при больших временах распространения сигнала фононной неравновесности значительную роль могут играть распадные процессы [16]. Заметим, что в рамках рассматриваемой в работе модели максимальная задержка сигнала фононной неравновесности будет наблюдаться в системе Y<sub>3-x</sub>Tb<sub>x</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, для которой известная величина энергетического параметра ДУС, связанного с каждым атомом примеси, составляет  $2.45 \text{ cm}^{-1}$  [17]. Для этой системы при обычных условиях эксперимента  $(T \simeq 3.5\,\mathrm{K}, \ x \simeq 0.5, \ L \simeq 1\,\mathrm{cm})$  значение  $t_2$  будет принимать значение порядка 5 · 10<sup>-3</sup> s, что сравнимо по величине с временами распадных процессов.

Таким образом, представлена достаточно простая теоретическая модель, содержащая два основных параметра — отношение теплоемкости всей системы к фононной теплоемкости C и отношение времени диффузионного распространения фононов к времени релаксации ДУС  $k_0$ . Этих двух параметров оказалось достаточно, чтобы описать основные аномалии в температурной и концентрационной зависимости процессов распространения слабонеравновесных фононов в системах, содержащих центры захвата. Дальнейшее уточнение модели (учет спектрального состава инжектируемых фононов, включение в рассмотрение нескольких подсистем ДУС, выход за пределы линейного приближения) позволит описать и более тонкие эффекты, наблюдаемые в экспериментах.

Автор выражает признательность С.Н. Иванову за плодотворные дискуссии и ценные замечания, а также Е.Н. Хазанову за предоставленную возможность ознакомиться с неопубликованными экспериментальными результатами.

#### Список литературы

- С.Н. Иванов, Е.Н. Хазанов, А.В. Таранов. Письма в ЖЭТФ 40, 1, 20 (1984).
- [2] С.Н. Иванов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 88, 1, 294 (1985).
- [3] С.Н. Иванов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 99, 4, 1311 (1991).

- [4] С.Н. Иванов, А.Г. Козорезов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 100, 5, 1591 (1991).
- [5] И.Б. Левинсон. ЖЭТФ 79, 4, 1394 (1980).
- [6] А.Г. Козорезов. ЖЭТФ 100, 5, 1577 (1991).
- [7] В.И. Козуб, А.М. Рудин. ФТТ 38, 2, 352 (1996).
- [8] Cz. Jasinkiewicz, P. Paszkievicz. Z. fur Phys. B77, 209 (1989).
- [9] С.Е. Куменков, В.И. Перель. ЖЭТФ 94, 1, 346 (1988).
- [10] С.Н. Иванов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов, В.А. Ацаркин, В.В. Демидов. ЖЭТФ 94, 5, 274 (1989).
- [11] С.А. Альтшулер, Б.М. Козырев. Электронный парамагнитный резонанс. Наука, М. (1972). 672 с.
- [12] С.Р. Арутюнян, Х.С. Багдасаров, А.П. Додокин, А.М. Кеворков. ФТТ **27**, *8*, 2299 (1985).
- [13] E.P. Steigmeier. Appl. Phys. Lett. 3, 2, 6 (1983).
- [14] О.В. Карбань, С.Н. Иванов, Е.И. Саламатов, С.Г. Быстров. Неорганические материалы 37, 1, 1 (2001).
- [15] С.Н. Иванов, А.Г. Козорезов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 102, 2, 600 (1992).
- [16] Б.А. Данильченко, С.Н. Иванов, Д.В. Поплавский, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ **112**, *1*, 325 (1997).
- [17] У.В. Валиев, Л.Л. Горбунова, М.М. Турганов, Б. Нексвил, Д. Сиранов. ФТТ 37, 4, 1176 (1995).